

[Skip to Main Content](#)

[IEEE.org](#) | [IEEE Xplore Digital Library](#) | [IEEE Standards Association](#) | [Spectrum Online](#) | [More IEEE Sites](#)



Search Term(s)

[Advanced Search](#) | [Preferences](#) | [Search Tips](#)

Browse

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)
- [Books](#)
- [Educational Courses](#)
- [Technology Surveys](#)

- [My Settings](#)
 - [Alerts](#)
 - [Purchase History](#)
 - [Saved Searches](#)
 - [Sign In](#)
 - [What can I access?](#)
- [Cart](#)

[Feedback](#)  [Help](#) 

Wed, 5 May 2010, 8:34:46 AM EDT

Search History For This Session

- [\(\(\(radiation\) AND millimeter\) OR submillimeter\) AND baffle, field, state, aperture \(116\)](#)
- [\(\(\(radiation\) AND millimeter\) OR submillimeter\) AND baffle, field, state \(192\)](#)



[Help](#) | [Contact Us](#) | [Privacy & Security](#) | [Site Map](#) | [IEEE.org](#) | [Nondiscrimination Policy](#)

© Copyright 2010 IEEE – All Rights Reserved

[Back to Top](#)